PAT-NO:

JP401207961A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 01207961 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

August 21, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAKANE, SUSUMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP63033333

APPL-DATE:

February 15, 1988

INT-CL (IPC): H01L023/50, H05K001/18

US-CL-CURRENT: 257/693

ABSTRACT:

PURPOSE: To fix a **semiconductor** device on a printed board simultaneously, by providing protrusions at an external lead of a package and inserting the

<u>semiconductor</u> device into a **<u>hole</u>** on the printed board.

CONSTITUTION: A lead frame 2 is connected electrically with an external circuit by Cu plating 3. A printed board 4 serves to fix the semiconductor device or to perform wiring for the external circuit and protrusions 6 serve to fix the semiconductor device onto the printed board 4. For example, wedge-shaped protrusions 6 having a maximum height 125μ m are provided at both side faces of the lead frame 2 having the size 0.25mm and the **lead** frame is **inserted into a hole** having a diameter 0.5mm on the printed board 4. The protruding 6 allow this device to be inserted into the printed board 4 but it is unable for the device to be disconnected from the printed board. Thus, this device is fixed on the printed board 4 without performing a solenoid process.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-207961

⑤Int.Cl.⁴

識別記号 : 庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)8月21日

H 01 L 23/50 H 05 K 1/18 N-7735-5F B-6736-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

劉発明の名称 半導体装置

②特 願 昭63-33333

20出 願 昭63(1988) 2月15日

⑩発明者 高 根

享 東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細 白皙

発明の名称
半導体装備

2. 特許請求の範囲

半導体装置の外部端子に該外部端子と一体的に 形成された突起部を有することを特徴とする半導 体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置に関し、特に半導体装置の 外部端子に固定用の突起部を設けた半導体装置に 関する。

〔従来の技術〕

従来、この種の半導体装置は第2図に示す様に 太さが一定のリードフレームを有していた。この 為半導体装置のプリント基板への固定及びプリント基板上の回路への電気的接続は、以下の方法で 行われていた。まず、プリント基板にリードフレームを通す為の挿入口を開け、挿入口内部及び周囲にCuメッキを行う。その後、半導体装置を所定個所に挿入する。次に挿入された半導体装置のプリント基板への固定及びプリント基板上の回路との電気的接続を行う為、高温にして溶解させた半田をCuメッキ部とリードフレームに付着させ冷却してCuメッキ部、リードフレーム、半田を合金化する。

〔発明が解決しようとする問題点〕

上述した従来の太さが一定のリードフレームは、 半導体装置をプリント基板へ挿入しただけではプリント基板より抜け落ちるという危険がある為、リードフレームとプリント基板上の回路とを半田付けする工程が不可欠である。しかし、半田付けという工程は半田を高温で溶解させ、溶解した半田をCuメッキ部、リードフレームに付着させる為、長時間高温にさらされたり高温過ぎたりした。場合、Cuメッキが倒れたりプリント基板の一部が焦げついたりリードフレームからの熱伝導によ

-1-

り半導体索子のアルミ電極が溶解する等の問題が 生じる。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明の半導体装置は、半導体装置の外部端子 に該外部端子と一体的に形成された突起部を有す ることを特徴とする。

〔実施例〕

次に本発明について図面を参照して説明する。 第1図は本発明の第1の実施例の縦断面図でである。モールド樹脂1は半導体のチップを外部体の 保護する為のもの、リードフレーム2は半導体の チップの信号を外部へ伝える為のもの、Cu気 チップの信号を外部へ伝える為のもの、Cu気 チップの信号を外部へ伝える為のもの、Cu気 気を行う為のもの、プリント 基板 4 は半導体を置 を固定する為又は外部回路を配線する為とのの を固定する為又は外部回路を配線する為とのの を固定する為又は外部回路を配線する為とのの を固定する為又は外部回路を配線する為とのの を置とプリント を行う為のものである。第1図の様に太さ0.25 mmのリードアレーム2の両側面に最大高125mm のクサビ形の突起部6を設け、直径0.5mm のクサビ形の突起部6を設け、直径0.5mm ント基板4上の穴に挿入する。半導体装置は突起

- 3 -

第3図は本発明の第3の実施例の縦断面図である。第3の実施例はセラミックのピン・グリット・アレイパッケージ(以下単にPGAと言う)に 突起部6を設けた場合の実施例である。PGAの リードピンは断面形状が一般に円形である為、突 起部6は円錐にする必要がある。

本発明の半導体装置は、モールド樹脂と、リードフレームと、リードフレームの一部にクサビ形の突起部を有している。この形状のリードフレームを使用した半導体装置をブリント基板へ挿入る。リードフレームの側面がクサビ形の為、挿入する際には比較的簡単に挿入できるが、一度挿入された半導体装置をブリント基板より引き抜く際には挿入口を大きくする等を行わない限り簡単には引き抜くことができない。従ってブリント基板とは引き抜くことができない。従ってブリント基板との回路が動作中の場合でも半導体装置が抜け落ちる必要がない。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、半導体装置の パッケージの外部リードに突起部を設けることに

- 5 -

部 6 の為にプリント基板 4 への挿入は可能であるが、引き抜くことは不可能となり、半田付け工程を行うことなく半導体装置のプリント基板 4 上への固定が可能となる。リードフレーム 2 の口径とフリント基板 4 のC u メッキ 3 が付着した 開孔部の口径は、リードフレーム 2 と C u メッキ 4 の厚っている 2 と C u メッキ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ キ 4 の P に C u ス マ エ ス ロ C u ス ロ C u ス

第2図は本発明の第2実施例の縦断面図である。 第1の実施例との違いは、第1の実施例の突起部 6の上部2~3㎜の部分に逆向きにクサビ形の突 起部6を設けたことである。すなわち、ブリント 基板4の両側からプリント基板4を挟む様になっ ている。これにより第1の実施例では半導体を ではされたブリント基板4に振動を与えた時に懸念 される半導体の振動による故障を最小限にすることができる。尚、突起部6の距離はブリント基板 4との厚さによって変るもので、上配の2~3㎜ と限るものではないことは言うもでもない。

- 4 -

より、半導体装置を挿入するだけで固定も同時に 行うことができるという効果がある。尚、本発明 はプリント基板に実装してから半田付けを行う場 合でもプリント基板と半導体装置を半田付けする までの間、固定性を良くする為に用いても非常に 有効であることは言うまでもない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の縦断面図、第 2図は本発明の第2の実施例の縦断面図、第3図・ は本発明の第3の実施例の縦断面図、第4図は従 来の半導体装置の縦断面図である。

1 ……モールド樹脂、2 ……リードフレーム、3 ……C u メッキ、4 ……プリント基板、5 … …半田、6 ……突起部、7 ……セラミックパッケージ、8 ……リードピン。

代理人 弁理士 内 原 晋

.

- 6 **-**

--320--



